

DCM-40错位测量显微镜

产品名称	DCM-40错位测量显微镜
公司名称	深圳克拉克贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区清泉路硅谷大院D302室
联系电话	15989565652

产品详情

DCM-40错位测量显微镜

DCM-40/60是一款设计独特的显微镜，可分别或同时观察物体的表面和底面图像，并对两图像进行比较，还可以通过测量装置测量两图像（表面和底面）的偏差。用途：直接测量AB两个面的错位尺寸

可选的物镜有五种，放大倍率从50X~100X。测量精度可达1 μ m。

DCM-40/60主要应用于微电子行业，特别是在半导体行业。产品上下面尺寸有偏移时就可以直接对比测量，减少其它间接测量方式的误差且不会损坏产品。例如：晶圆划片基准印字偏移，柔性线路板线路间距，陶瓷电容片切割对位和IC框架边缘质量等应用。

规格：

型号	DCM-40	DCM-60
物镜	5X, 10X, 20X ,40X, 100X	
工作台	50X50mm 100X100mm	150X150mm
光源	150W卤素灯2套	
工件厚度	20mm	30mm
选配件	照相系统、TV系统	

测量步骤：

- 1.将"光路选择开关"旋转到"Top& Bottom"位置，调整上、下物体的光轴至重合。
- 2.将工件置于工作台上。旋转"光路选择开关"到"Top"位置，对焦上表面..
- 3.旋转“光路选择开关"到"Bottom ”位置，对焦下表面。 .
- 4.将“光路选择开关"旋转到"Top &Bottom"位置，测量两图像的位置偏差。